

Tagungsbeiträge / Anmeldung

Die Anmeldung zur PRORA 2015 erfolgt ausschließlich über das Onlineformular auf www.iap-adlershof.de/fachtagungen

Die Einreichung von Vorträgen sowie Postern ist bis zum 14.08.2015 möglich. Dazu sind der Titel des Beitrages und eine Kurzfassung beizufügen.

Für Anmeldungen von Teilnehmern und Ausstellern wird bis zum 14.08.2015 ein Vorzugspreis gewährt. Insbesondere Studenten sind auf der Tagung als Teilnehmer herzlich willkommen. Die Buchung von Hotelzimmern im Airporthotel Berlin-Adlershof zum Vorzugspreis kann im Rahmen des verfügbaren Kontingentes bis zum 8.10.2015 erfolgen.

Preise

Teilnahmekosten	Anmeldung bis 14.08.2015	Anmeldung ab 15.08.2015
Regulärer Teilnehmer	150,00 €	200,00 €
Studenten	20,00 €	55,00 €
Ausstellungsfläche	110,00 €/m ²	150,00 €/m ²

Übernachtung	Vorzugspreis bis 8.10.2015 nach Verfügbarkeit
Einzelzimmer	64,00 € pro Zimmer/Nacht, zzgl. Frühstück
Doppelzimmer	79,00 € pro Zimmer/Nacht, zzgl. Frühstück

Rahmenveranstaltung

Besonders hingewiesen wird auf das Satellite-Meeting des Berlin Laboratory of Innovative XRay Technology (BLIX) und das anschließende Stiftertreffen an der TU Berlin am 11.11.2015.

Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
 Tel.: (030) 63 92-65 09
 Frau D. Zimani (Sekr. IAP e. V.)
 Tel.: (030) 63 92-65 00
 IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
 Rudower Chaussee 29/31
 12489 Berlin
 Fax: (030) 63 92-6501
 E-Mail: info@iap-adlershof.de

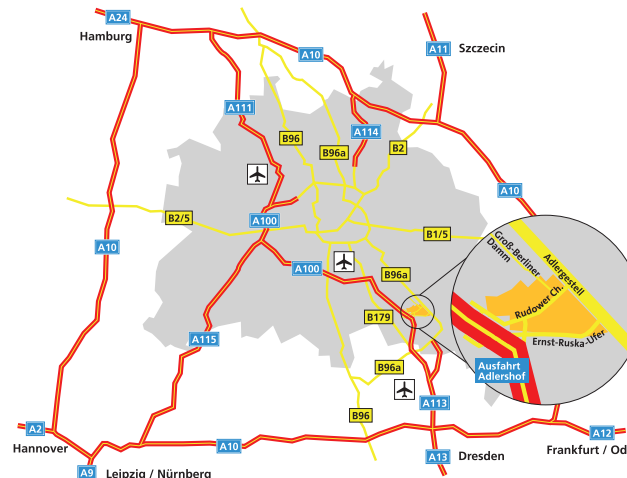
Veranstalter

IAP Institut für angewandte Photonik e.V., Berlin
 IfG – Institute for Scientific Instruments GmbH, Berlin
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
 Bruker Nano GmbH, Berlin
 Helmut-Fischer-Stiftung, Stuttgart
 Optec Berlin-Brandenburg e.V.
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
 Arbeitskreis Prozessanalytik
 SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
 Technische Universität Berlin
 TSB – Technologiestiftung, Berlin
 VDI/VDE – Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)
 VDI-Bezirksgruppe Adlershof
 WISTA-MANAGEMENT GMBH
 Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

Programmkomitee

B. Beckhoff, PTB, Berlin
 A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
 G. Bruno, BAM, Berlin und Universität Potsdam
 F. Burgäzy, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
 N. Esser, ISAS, Berlin
 J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg
 B. Kanngießer, TU Berlin
 A. Kharchenko, PANalytical, Almelo, Niederlande
 M. Krumrey, PTB, Berlin
 N. Langhoff, IAP e.V., Berlin
 F. Lerch, OpTecBB, Berlin
 M. Maiwald, BAM, Berlin
 H. Miersch, Spectro Analytical Instruments GmbH, Kleve
 M. Ostermann, BAM, Berlin
 U. Panne, BAM und HU Berlin
 P. U. Pennartz, Rigaku Innovative Technologies
 Th. Schüle, Bruker Nano GmbH, Berlin
 H. Stiel, MBI, Berlin
 U. Waldschläger, Bruker Nano GmbH, Berlin
 R. Wedell, IAP e.V., Berlin
 J. Wiesmann, Incoatec GmbH, Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter www.adlershof.de



Tagungsankündigung

Fachtagung

Prozessnahe Röntgenanalytik

12. und 13. November 2015

im WISTA – Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof
 Einstein-/Newton-Kabinett
 Bunsensaal
 Rudower Chaussee 17
 12489 Berlin



Die 8. Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik PRORA findet am 12. und 13. November 2015 im Jahr des Lichts statt. Der Veranstaltungsort ist traditionsgemäß der Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof. Die Fachtagung wird wieder von einer Geräteausstellung begleitet. Das Jahr des Lichts prädestiniert nicht nur den Röntgenbereich des elektromagnetischen Spektrums für analytische Zwecke zu nutzen. Daher sollten auch optische Messverfahren in Kombination mit Röntgenanalytik Gegenstand der Fachtagung und der Geräteausstellung sein.



Die Prozessanalysetechnik liefert die Voraussetzung für die zukünftigen Automatisierungskonzepte, wie sie u. a. durch das Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ adressiert werden. Hierzu soll auch die diesjährige Fachtagung PRORA einen Beitrag leisten. Die Fachtagung und Fachausstellung PRORA richtet sich an alle Anwender, Entwickler und Hersteller aus dem Bereich der prozessnahen Röntgenanalytik und damit verwandter/kombinierter optischer Messverfahren. Bei der diesjährigen Fachtagung soll ein breites Spektrum von prozessanalytischen Verfahren behandelt werden, die eine Vernetzung der Sensorik mit Steuer- und Regelprozessen deutlich machen. Wichtige Anwendungen sind weiterhin die Recyclingwirtschaft zur Wiedergewinnung von knappen Wertstoffen. Außerdem sind auch prozessanalytische Verfahren zur Sicherung eines sparsamen Einsatzes von Energie und Rohstoffen in der Produktion von hochwertigen Gütern der Elektrotechnik/Elektronikindustrie, der chemischen Industrie, der Automobilindustrie und des Maschinenbaus ein wichtiges Thema.

Neben den bereits im industriellen Einsatz befindlichen prozessnahen röntgenanalytischen Verfahren sind Neuentwicklungen aus der Forschung und den innovativen Unternehmen ein wichtiger Gegenstand der Fachtagung. Dies betrifft nicht nur Geräte, Anlagen und Methoden sondern auch einzelne Komponenten.

Damit die Aussteller Gelegenheit erhalten, ihre Tätigkeitsschwerpunkte vorzustellen, werden ihnen Kurzbeiträge von 3 Minuten unmittelbar vor der Postersitzung am 12.11.2015 eingeräumt. Diese müssen aber angemeldet werden, damit sie im Programm berücksichtigt werden können. Der Aufbau der Ausstellung kann bereits am 11. 11. 2015 ab 13.00 Uhr im Bunsensaal erfolgen.

Themenfelder

Methodische

Herausforderungen

- Vergleich und Kopplung verschiedener sensorgestützter analytischer Verfahren unter Nutzung des elektromagnetischen Spektrums (Röntgenbereich, VUV, Infrarotbereich Terahertz) zur Prozesskontrolle
- Neue methodische Ansätze beim Einsatz der Röntgenanalytik (XRF, XRD, XAFS, XAS) unter Industriebedingungen
- Einsatz von Referenzproben und Standards
- Softwareentwicklung zur Auswertung der Messdaten für Qualitätskontrolle und Steuerung von technologischen Prozessen
- Herausforderungen der Vor-Ort-Analyse an Messgeräten und Peripherie
- Besonderheiten beim Einsatz von Handgeräten mit korrelativen Messverfahren (UV, NIR, Raman, LIBS, Röntgen)

Applikationen in der Industrie

- Prozessanalytik im Bereich Recycling
- Ressourcenanalytik im Bereich der Rohstoffe (Erze, Steine, Erden)
- Beispiele aus Maschinenbau, Elektronik-, Automobilindustrie, chemischer Industrie im Hinblick auf eine Vernetzung von Objekten, Sensoren und Steuerungen im Produktionsablauf

- Kombination röntgenanalytischer und optischer Messverfahren im industriellen Einsatz
- Dünnschichtanalytik mit verschiedenen Verfahren (Röntgenanalytik, Infrarotellipsometrie, VUV)
- Röntgenanalytik an Fluiden

Neue röntgenanalytische Methoden

- Röntgenmikroanalyse (WD) leichter Elemente mit Hilfe von Fresnel-Optiken, Nachweis von Li
- Zeitaufgelöste Röntgentechniken
- Röntgenrefraktometrie
- Röntgenmikroskopie mit Laborgeräten
- Speziation mittels Röntgen-Emissions- und Absorptions-Spektroskopie

Neue Entwicklungen bei Komponenten für prozessanalytische Geräte

- Kombinierte röntgen- und lichtoptische Bauelemente
- Weiterentwicklung der Kapillaroptiken
- Fresnel- und Gitteroptiken für den niederenergetischen Röntgenbereich
- Laborröntgenquellen für den Prozesseinsatz
- Neuentwicklungen bei den Detektionssystemen für den prozessnahen Einsatz